

各 位

2013 年 1 月 15 日

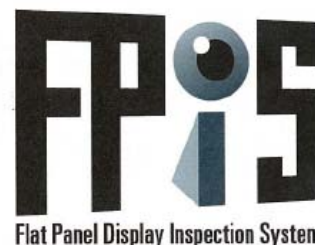
会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 田中邦明
(東証第一部 コード番号: 4312)
お問い合わせ先 広報室室長 野口泰伸
電 話 番 号 03-5297-3066

FPD 欠陥検査システム「FPIS」 国内販売開始のお知らせ

LCD や有機 EL 等、高精細ディスプレイの発光欠陥を高精度、短時間で測定

サイバネットシステム株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：田中 邦明、以下「サイバネット」）は、自社開発した FPD（フラットパネルディスプレイ）欠陥検査システム「FPIS（エフピーアイエス）」の販売を 2013 年 2 月 1 日より開始することをお知らせいたします。

テレビなどの大型ディスプレイ分野は、グローバル競争が激化し、市場からの低価格化要求が高まっております。一方、スマートフォンやタブレットといった中小型ディスプレイ分野は市場が伸長しており、よりハイエンドの薄型・高精細な LCD（液晶ディスプレイ）や OLED（有機 EL）パネルの開発が求められております。そのような厳しい状況下において、FPD 製造会社は、開発製品の品質向上および開発プロセスの短縮が必要不可欠となっております。新開発パネルの検査工程においては、検査員の個人差による測定誤差や測定の手間による検査コストが課題となっております。



サイバネットがリリースする「FPIS」は、目視では検出困難な高精細ディスプレイの欠陥を、移動ステージを使用することなく検出可能とします。また、検査員の個人差に影響されない正確且つ定量的な評価を実現します。また、製品シリーズの「高精度版」は、ディスプレイ内の全サブ画素 1 個 1 個の輝度(※1)を測定することが可能となり、画素毎の輝度のばらつきを評価することができます。

本システムは、新開発の OLED ディスプレイや 4K2K のような高精細 LCD の正確な欠陥解析と検査時間の短縮化により、開発製品の品質向上と開発から製造に至るコスト削減に貢献いたします。

本システムは、日本だけでなく、中国、台湾での販売も視野に入れております。販売計画は、国内外合わせ初年度 2 億円、3 年目には 5 億円を目指しております。

※1：輝度：単色での相対輝度



大型向け FPIS



中小型向け FPIS

PRESS RELEASE

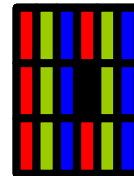
製品の機能/特長

特長

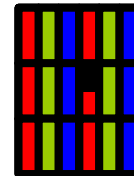
- 欠陥画素を検出し、その正確なアドレスを出力
- 1台のカメラでディスプレイ全体を撮影
- ディスプレイとカメラの位置合わせが容易
- 全サブ画素1個1個の輝度を短時間で測定可能（高精度版）

測定項目

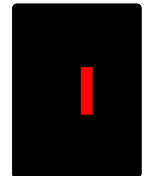
- 欠陥画素（減点、輝点、線欠陥）の検出
 - 欠陥画素の正確なアドレス出力
 - 欠陥検出欠陥の一覧表出力
- FPD 全画面の輝度分布測定
 - 各階調検査
 - クロストーク検査
 - 全サブ画素のビットマップ表示
 - 断面グラフ表示（グラデーション評価）
- 輝度均一性評価
 - 画面全体のグローバル評価
 - メッシュ分割でのローカル評価
- サブ画素1個1個の輝度測定（高精度版）
 - ビットマップ表示、出力（BMP ファイル）
 - 数値出力（輝度係数、校正係数）（CSV ファイル）



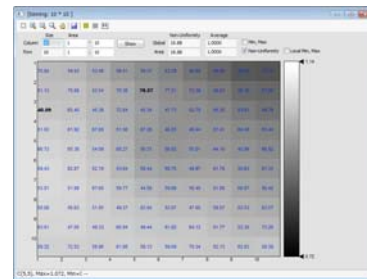
減点
(全欠陥)



減点
(半欠陥)



輝点

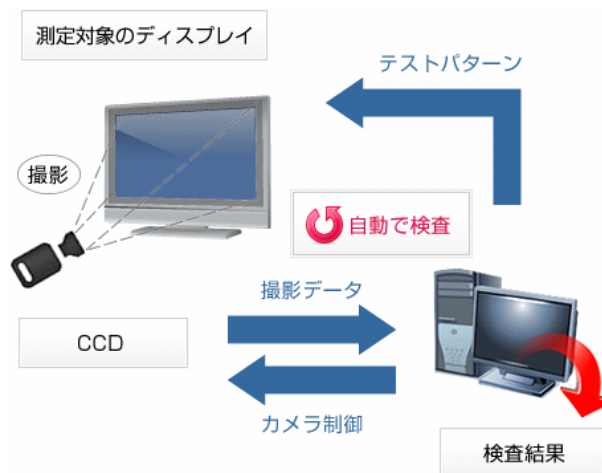


輝度均一性解析機能(メッシュ分割)

システム構成

- 測定部(PC 接続用 USB ケーブル含む)
- 計測解析用ソフトウェア

図 1：システム構成略図



PRESS RELEASE

図 2：計測解析用ソフトウェア画面



製品シリーズ

高精度版

- ディスプレイの全サブ画素 1 個 1 個の輝度を短時間で測定可能
 - ディスプレイ全体を一度に撮影
 - 分割測定（ステージでカメラを動かしての撮影）は必要なし
- 全サブ画素の輝度から欠陥画素の検出を行う
- 全サブ画素の輝度から輝度均一性を評価
- 高速版と同等の輝度分布測定機能

高速版

- 高速に欠陥画素を検出
- 画面全体の輝度分布測定
 - 階調検査
 - クロストーク検査
 - 断面グラフ表示（グラデーション評価）
- 輝度均一性評価
 - 画面全体
 - メッシュ分割

オプション

- ディスプレイ全面の色度分布測定
- マイクロスコープによる拡大検査
 - 欠陥画素を検出した位置にマイクロスコープを自動的に移動し、欠陥画素を詳細に観察
- 光オシロスコープによる光強度の時間変化測定
 - 液晶応答性検査
 - フリッカ評価
 - アクティブシャッタータイプ 3D ディスプレイのクロストーク評価
- サブ画素毎の輝度補正（高精度版）
 - OLED、LED、プラズマディスプレイの画素毎の輝度ばらつきを補正して表示

詳しくは下記お問合せ先まで、別途ご連絡ください。

展示会出展予定

第 30 回 エレクトロテスト ジャパン

「FPIS」の展示、デモを行う予定です。

日時:2013年1月16日(水)~18(金)
会場:東京ビックサイト 東 50-002
詳細: <http://www.electrotest.jp/ja/>

価格

価格につきましては、下記お問合せ先までご連絡ください。

FPISの詳細については、下記 Web サイトをご覧ください。
<http://www.cybernet.co.jp/fpis>

サイバネットについて

サイバネットシステム株式会社は、科学技術計算分野、特に CAE (※) 関連の多岐にわたる先端的なソフトウェアソリューションサービスの提供を行っております。

電気機器、輸送用機器、機械、精密機器、医療、教育・研究機関など様々な業種及び適用分野におけるソフトウェア、教育サービス、技術サポート、コンサルティング等を提供しております。構造解析、音響解析、機構解析、制御系解析、通信システム解析、信号処理、光学設計、照明解析、電子回路設計、汎用可視化処理、医用画像処理など多様かつ世界的レベルの CAE ソフトウェアを取扱い、様々な顧客ニーズに対応しております。

また、ビジネスプロセスの効率化を実現する各種ソフトウェアの提供や、個人情報や秘密情報などの漏洩・不正アクセス対策、データのアーカイブと保護、認証強化などでクライアント PC・サーバのセキュリティレベルを向上させる IT ソリューションの提供をしております。

サイバネットシステム株式会社に関する詳しい情報については、下記 Web サイトをご覧ください。

<http://www.cybernet.co.jp/>

※CAE (Computer Aided Engineering): 「ものづくり」における研究・開発時に、従来行われていた試作品によるテストや実験をコンピュータ上の試作品でシミュレーションし分析する技術。試作や実験の回数を劇的に減らすと共に、様々な問題をもれなく多方面にわたって予想・解決し、試作実験による廃材を激減させる環境に配慮した「ものづくり」の実現に貢献する。

本件に関するお問い合わせ サイバネットシステム株式会社

- 内容について
オペティカル事業部 営業推進グループ/近藤、山中
TEL : 03-5297-3703 E-MAIL : optsales@cybernet.co.jp

- 報道の方は
広報室/渡辺
TEL : 03-5297-3066 E-MAIL : irquery@cybernet.co.jp